

AGT-806 膜厚計簡易說明書

1. 遠離任何金屬物質至少 5CM 以上，開機並倒數完成
2. um/mil 鍵：選擇單位 (建議用公制單位 um)
3. MODE 鍵：選擇測量模式，SNG：單點測量模式，CON：連續測量模式
(注：使用 CON 請勿按 ZERO 鍵，此時 ZERO 鍵為自定義校準，若不慎按錯請恢復出廠值即可)
(恢復出廠值：長按住 um/mil 單位鍵至螢幕全顯併有連續兩聲即可)
4. 探頭垂直上垂直下測量，若有歪斜可能導致精度不准請重新測量
5. 系統會自動探測分別為鐵(Fe：磁性材料)或非鐵(NF：非磁性材料)
6. 系統不使用五分鐘自動關機

校準說明

1. 取出鐵或非鐵基材並放上校準片，並確認精度是否在合乎範圍內(若不合乎精度可進行以下(2.)所述之歸零校正)
2. 歸零校準：按 MODE 選擇 CON(連續測量模式)，儀器平順且平壓於基材上若發現不為零即可進行以下校準方式
將探頭平押於基材上，按一下 ZERO 鍵，即完成歸零動作

使用基本說明

1. 嚴禁將校準片兩片重疊使用此方式並不準確
2. 待測物曲率半徑過陡或面積過小或表面過粗糙
3. 取至少三點以上作平均值
4. 嚴禁電池電量不足時
5. 嚴禁環境溫差過大時
6. 嚴禁附近有強磁場時

技術參數

類型	Fe 鐵基 (磁性)	NF 非鐵 (非磁) (鋁及銅等非磁性基材)
原理	電磁感應	渦流效應
測量範圍	0-1300um	0-1300um
精度	正負(3%+2um)	正負(3%+2um)
分辨率	0.1um	0.1um
校準	零點校準及多點校準	
單位	um(毫米)/mil(密耳)(美國慣用單位)	
最小凸面曲率半徑	1.5mm	
最小凹面曲率半徑	25mm	
最小測量面積直徑	6mm	
超作環境	0-40°C,20%-90%RH 無強磁場環境	
最小基材厚度	0.5mm	0.3mm
電源	四顆三號電池(AAA)	
重量	125 克(不含電池)	